

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ

УДК 548.0:535.37:548.736

Посвящается памяти Н.В. Белова

ОПТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КРИСТАЛЛОВ СЕМЕЙСТВА ЛАНГАСИТА

© 2011 г. Т. Ф. Веремейчик

Институт кристаллографии РАН, Москва

E-mail: vtam@ns.crys.ras.ru

Поступила в редакцию 11.07.2011 г.

Рассмотрены зависимости между величиной рефракции и структурными параметрами в кристаллах семейства лангасита $\text{La}_3\text{Ga}_{5.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_{14}$, $\text{La}_3\text{Ga}_{5.5}\text{Ta}_{0.5}\text{O}_{14}$, $\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}$, $\text{Ca}_3\text{Ga}_2\text{Ge}_4\text{O}_{14}$, $\text{Sr}_3\text{Ga}_2\text{Ge}_4\text{O}_{14}$. Показано, что угол отклонения от 60° граней октаэдра $1a$, перпендикулярных оптической оси, является одной из главных причин оптической активности этих кристаллов. К основным взаимодействиям, влияющим на величину угла, отнесены взаимодействие катионов додекаэдра $3e$ и октаэдра $1a$, додекаэдра $3e$ и тетраэдра $2d$, а также отталкивание ионов O^{2-} . Выполнен анализ зависимостей величины угла от кристаллохимических характеристик рассмотренных кристаллов. Показана роль относительных размеров полизэдр структуры.

ВВЕДЕНИЕ

Рефракция связана с оптической активностью зависимостью от некоторых одинаковых характеристик вещества, в том числе показателя преломления и поляризуемости ионов. Как рефракция, так и оптическая активность высокочувствительны к структуре среды [1–3]. С другой стороны, с углом φ , характеризующим отклонение от 60° поворота перпендикулярных оптической оси с противоположных граней октаэдра $1a$, связывается оптическая активность в кристаллах семейства лангасита (структуре Са-галлогерманата, пр. гр. $P321$) [4], не обладающих винтовой осью.

В [4] показана корреляция угла φ с величинами удельного вращения плоскости поляризации и знака вращения для кристаллов $\text{Sr}_3\text{Ga}_2\text{Ge}_4\text{O}_{14}$ и $\text{La}_3\text{Ga}_{5.5}\text{Ta}_{0.5}\text{O}_{14}$. Корреляция знака вращения с конфигурацией осей структуры и соотношением ионов в смешанных позициях кристаллов обнаружена в [5–7]. Корреляция величин рефракции и угла φ продемонстрирована в [8] для кристаллов $\text{La}_3\text{Ga}_{5.5}\text{Ta}_{0.5}\text{O}_{14}$, $\text{La}_3\text{Ga}_{5.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_{14}$, $\text{La}_3\text{Ga}_5\text{GeO}_{14}$, $\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}$, $\text{Sr}_3\text{Ga}_2\text{Ge}_4\text{O}_{14}$, $\text{Ca}_3\text{Ga}_2\text{Ge}_4\text{O}_{14}$.

Отметим, что в других структурах, например, в ряде оптически активных молекулярных кристаллов со структурой пр. гр. $P321$ основным элементом структуры является октаэдрически координированный комплекс. При этом октаэдр имеет аналогичные октаэдру в структуре кристаллов семейства лангасита искажения — локальная симметрия позиции катиона D_3 [9]. Кристаллы солей $\text{R}_2\text{S}_2\text{O}_6$ и $\text{MS}_2\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, где $\text{R} = \text{K}, \text{Rb}$, а $\text{M} = \text{Sr}, \text{Ca}, \text{Pb}$ со структурой пр. гр. $P321$ тоже обладают оптической активностью из-за образования сильно

деформированной псевдотригональной оси 3_1 , создающей винтовую структуру. При этом ионы K, Rb центрируют искаженные октаэдры из ионов O^{2-} , но в винтовой структуре не участвуют. Эту структуру образует группировка $\text{S}_2\text{O}_6^{2-}$ [9].

В пр. гр. $P321$ возможны разные механизмы возникновения оптической активности за счет небольших изменений структуры. При этом структура пространственной подгруппы приближается к более симметричной структуре надгруппы. Ближайшие надгруппы пр. гр. $P321 - P3_{1}21$ и $P3_{2}21$, обладающие винтовыми осями. Метод поиска винтовой оси в структурах развит в [10].

В структуре кристаллов семейства лангасита угол φ особенно увеличивает неинверсионные (нечетные) составляющие потенциала в октаэдре, которые могут привести к винтовой оси. Нарушение в поглощающей среде инвариантности потенциала относительно инверсии и приводит к разности поглощения право- и левополяризованных фотонов. Влияние угла φ наглядно проявляется, например в спектральных и лазерных свойствах активированных кристаллов SGG, CGG [11]. Угол φ приводит к возрастанию сил осцилляторов переходов между рабочими уровнями иона активатара переходного элемента в октаэдре $1a$. Отметим, что смещения ионов и их электронных оболочек, которым пропорциональна величина рефракции, играют базовую роль в пьезо-, нелинейном оптическом и других эффектах в кристаллах структурного типа лангасита.

В работе рассматриваются зависимости величин рефракции и угла φ для кристаллов $\text{La}_3\text{Ga}_{5.5}\text{Ta}_{0.5}\text{O}_{14}$ (**LGT**), $\text{La}_3\text{Ga}_{5.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_{14}$ (**LGN**),

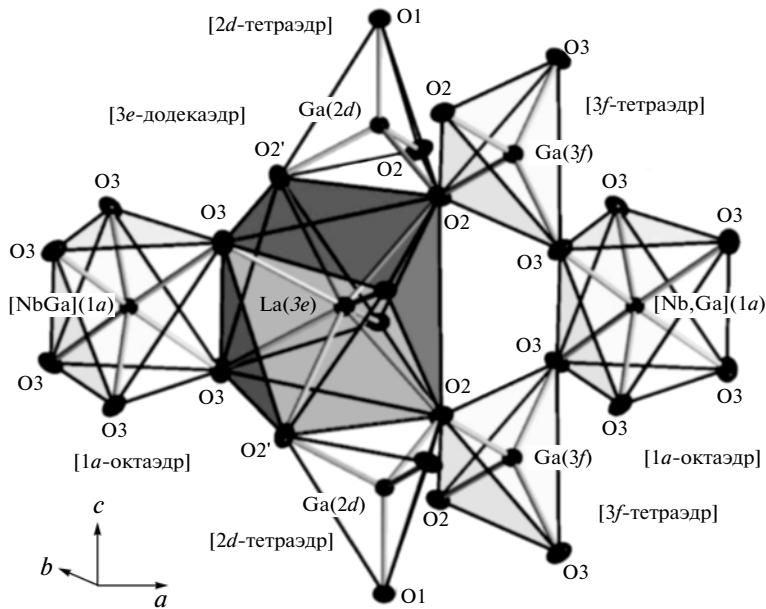


Рис. 1. Фрагмент структуры кристалла $\text{La}_3\text{Nb}_{0.5}\text{Ga}_{5.5}\text{O}_{14}$: вдоль оси ячейки a слева направо расположены $[\text{Nb},\text{Ga}]$ -октаэдр, La-полиэдр и трансляционно идентичный $[\text{Nb},\text{Ga}]$ -октаэдр. Сверху и снизу к La-полиэдру примыкают тетраэдры $\text{Ga}(2d)$ и $\text{Ga}(3f)$.

$\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}$ (LGS), $\text{Sr}_3\text{Ga}_2\text{Ge}_4\text{O}_{14}$ (SGG), $\text{Ca}_3\text{Ga}_2\text{Ge}_4\text{O}_{14}$ (CGG) семейства лангасита от их структурных характеристик и химического состава. В настоящей работе использованы структурные данные [12–14].

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛОВ

Свободные ионы La^{3+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} , Ga^{3+} , Ta^{5+} , Nb^{5+} , Ge^{4+} , Si^{4+} имеют электронные оболочки ns^2np^6 типа оболочек инертных газов со сферически симметричным распределением электронной плотности в основном состоянии 1S . В кристалле такие оболочки сферически симметричны, по крайней мере, в окрестности ядерной области, протяженность которой зависит от величины и симметрии потенциала кристаллического поля. Ионы с термом 1S основного состояния вообще формируют в кристалле в сравнении с ионами других типов электронных оболочек (при равных кристаллохимических условиях) менее локализованные химические связи, способствующие их подвижности по осям симметрии [15]. Ионы с заполненными оболочками типа инертных газов должны быть особенно высокоподвижны.

Величина смещения заряда $P = \alpha_0 E$, где P – поляризация, смещение заряда; E – напряженность потенциала кристалла на ионе; α_0 – общая поляризуемость, соответствующая смещению иона и электронной плотности на химической связи. Для ионов с электронной оболочкой типа инертных газов в электронной поляризуемости α :

$$\alpha = 1/3(\alpha_{||} + 2\alpha_{\perp}), \quad (1)$$

относительная величина α_{\perp} превышает значения для ионов с другими типами оболочек [2, 3]. Здесь $\alpha_{||}$ и α_{\perp} – поляризуемости параллельно и перпендикулярно химической связи соответственно.

Структура типа Ca-галлогерманата (рис. 1) формируется вокруг оси C_2 по кратчайшему расстоянию между крупными катионами в додекаэдре $3e$ и октаэдре $1a$ и оси C_3 октаэдра $1a$, совпадающей с оптической осью. Ионы O_2 , O_3 занимают общие позиции. Катионы в додекаэдре $3e$ и тетраэдре $3f$ имеют позиции локальной симметрии C_2 , а в тетраэдре $2d$ – C_3 . Локальная симметрия позиции катиона в октаэдре $1a$ – D_3 . Додекаэдр $3e$ и октаэдр $1a$ имеют общее ребро O_3 – O_3 . Между слоями октаэдров и додекаэдров, расположенных вокруг октаэдров по закону тройной оси, расположены тетраэдры $3f$, имеющие с октаэдрами общие вершины (ионы O_3), и $2d$, имеющие общее ребро (O_2 – O_2) с додекаэдром $3e$. Таким образом, позиции катионов обладают только осями симметрии. Соотношения катионов в смешанных позициях структуры приведены в табл. 1.

Особенности электронных оболочек всех катионов и уникальное соответствие оболочек симметрии позиций могут привести к гладким зависимостям величин рефракции и угла ϕ от кристаллохимических характеристик кристаллов.

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЕЛИЧИНЫ РЕФРАКЦИИ

Экспериментальные и вычисленные величины рефракции и угла ϕ коррелируют (кроме кристалла CGG) (табл. 2). Отметим, что метод вычисления рефракции основан на правиле аддитивности рефракций формульных единиц соединения и не учитывает структурный параметр низкосимметричного искажения, каким является угол ϕ .

Величина молекулярной рефракции R_m диэлектрика:

$$R_m = V(\epsilon - 1)(\epsilon + 2) = 4\pi N \alpha / 3, \quad (2)$$

V – мольный объем, ϵ – диэлектрическая проницаемость, N – число Авогадро.

Экспериментальные значения $R_{\text{эксп}}$ для исследованных кристаллов получены в [1]. В настоящей работе выполнены расчеты кристаллической ионной рефракции R_i с учетом реальных соотношений содержания катионов в смешанных позициях кристаллов SGG, CGG (табл. 1). Эти результаты и полученные в [1] показали несущественные отличия. Отклонения значений R_i от $R_{\text{эксп}}$ составили 5–10%, что в среднем меньше среднестатистической ошибки (~9%) для неорганических кристаллов [2, 3]. Вычисленные вклады $R(3e)$, $R(1a)$, $R(3f)$, $R(2d)$ от полиэдров структуры в суммарную величину R_i приведены (в %) в табл. 2. Если рассмотреть вклад ионов по отдельности, то в величинах R_i преобладает вклад ионов O^{2-} .

Максимальные величины R_i соответствуют крупным и высокозарядным ионам [2, 3] и большому числу ионов O^{2-} , сопоставляемым им в структурном фрагменте (табл. 2). Для ионов La^{3+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} величины R_i равны 5.4, 3.8, 2.3 соответственно и сопоставляется $3/2$, 1, 1 иона O^{2-} . Ионам Ta^{5+} , Nb^{5+} ($R_i = 2.7$) сопоставляется 5/2 ионов O^{2-} . Для ионов малых ионных радиусов Ga^{3+} , Ge^{4+} , Si^{4+} величины R_i невысоки – 1.6, 1.5, 0.3 соответственно.

Для ионов в соединениях поляризуемость $\alpha \sim kr_i^n$, где r_i – ионный радиус, а параметры k и n зависят от соединения (для свободных ионов $\alpha \sim r_i^3$). Зависимостью α и r_i объясняется пропорциональность величин $R_{\text{эксп}}$, R_i и наименьшему параметру элементарной ячейки c , параметру, который, в свою очередь, зависит от суммы радиусов ионов (рис. 2). Аналогичная зависимость, но от параметра ячейки a ранее была обнаружена для величины пьезомодуля кристаллов семейства лангасита [16]. Эта зависимость является главной тенденцией, которая может нарушаться влиянием тетраэдров $3f$ и $2d$.

Сравним величины R и отношения средних радиусов полиэдров – $\beta_1 = r_{\text{cp}}(3e)/r_{\text{cp}}(1a)$, $\beta_2 = r_{\text{cp}}(3e)/r_{\text{cp}}(3f)$, $\beta_3 = r_{\text{cp}}(3e)/r_{\text{cp}}(2d)$ (табл. 3, 4). Для

Таблица 1. Соотношение катионов в смешанных позициях кристаллов LGT, LGN, LGS, SGG, CGG

Кристалл, позиция	Соотношение катионов
LGN, 1a	0.50Ga ³⁺ + 0.50Nb ⁵⁺
LGT, 1a	0.50Ga ³⁺ + 0.50Ta ⁵⁺
CGG, 1a	0.74Ga ³⁺ + 0.26Ge ⁴⁺
CGG, 3f	0.58Ga ³⁺ + 0.42Ge ⁴⁺
LGS, 2d	0.50Ga ³⁺ + 0.50Si ⁴⁺
SGG, 1a	0.14Ga ³⁺ + 0.86Ge ⁴⁺
SGG, 3f	0.62Ga ³⁺ + 0.38Ge ⁴⁺

Таблица 2. Экспериментальные величины рефракции $R_{\text{эксп}}$, вычисленные рефракции R_i [1], угол ϕ и вычисленные вклады R в величины R_i от полиэдров структуры и от общего количества ионов O^{2-} для кристаллов LGT, LGN, LGS, SGG, CGG*

Рефракция, угол ϕ	Кристалл				
	LGN	LGT	LGS	SGG	CGG
$R_{\text{эксп}}$	88.4	88.4	82.8	77.5	72.9
R_i	79.6	79.6	77.7	73.9	69.3
ϕ , град	19.7	19.5	17.7	12.3	18.6
$R(3e)$, %	41.9	41.9	42.9	30.9	26.4
$R(1a)$ %	12.2	12.2	9.4	8.4	8.9
$R(3f)$, %	27.6	27.6	28.2	32.5	35.2
$R(2d)$, %	18.4	18.4	19.6	24.6	26.3
$R(O^{2-})$, %	66.9	66.9	67.4	68.5	76.8

* Последовательность кристаллов соответствует уменьшению величин $R_{\text{эксп}}$, R_i , угол ϕ равен разности угла разворота граней правильного октаэдра (60°) и удвоенного угла наклона ребра O3–O3 относительно высоты h октаэдра.

La-кристаллов LGT, LGN, LGS величины β_i равны 1.3, 1.4, 1.4; 1.3, 1.4, 1.4; 1.3, 1.4, 1.5 (табл. 4), а величины $R(3e)/R(1a)$, $R(3e)/R(3f)$, $R(3e)/R(2d)$ – 1.5, 2.6, 3.4; 1.5, 2.6, 3.4; 1.5, 2.2, 4.5 соответственно (табл. 2). Увеличение коэффициентов пропорциональности в соотношении для R соответствует степенной зависимости α от r_i , а возрастание β_3 для кристалла LGS – минимальной величины $r_{\text{cp}}(2d)$.

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УГОЛ ϕ

Величина угла ϕ обратно пропорциональна параметрам β_1 , β_2 , β_3 (табл. 2, 4). Наименее стабильны структурные параметры малого тетраэдра $2d$. 1a, 3f более стабильны и меняются только для кристалла SGG. Величины β_1 , β_2 , β_3 в первом приближении равны для кристаллов LGT и LGN, LGS и CGG.

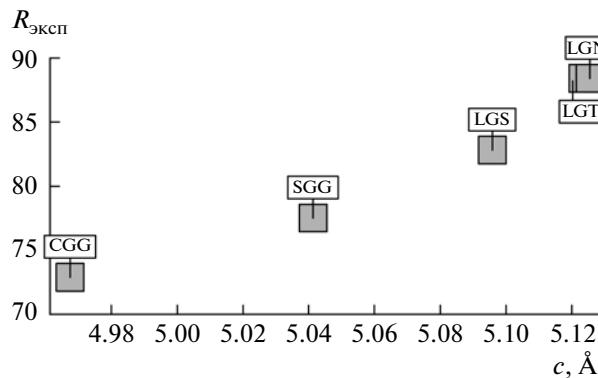


Рис. 2. Зависимость величины рефракции $R_{\text{эксп}}$ от параметра ячейки c для кристаллов LGN, LGT, LGS, SGG, CGG.

Величина угла φ также обратно пропорциональна отношениям длин связей ($O_2-O_2)/(O_3-O_3)$, и объемов $V(3e)/V(2d)$. Для ряда кристаллов LGT, LGN, CGG, LGS, SGG последовательность неокругленных отношений объемов полиэдров $V(3e)/V(2d)$ равна 9.384, 9.389, 10.186, 10.950, 11.198 и соответствует уменьшению угла. Зависимость величины угла φ от величины разности $(a/c) - [r_{\text{cp}}(3e)/r_{\text{cp}}(3f) + r_{\text{cp}}(3e)/r_{\text{cp}}(2d)]$ (табл. 3–5) имеет гладкий характер (рис. 3) и, по-видимому, отражает отношение размеров октаэдра по оси a и c , т.е. отношение величин его ребер к высоте.

ФАКТОРЫ НЕИНВЕРСИОННОГО СМЕЩЕНИЯ ГРАНЕЙ ОКТАЭДРА

Устойчивости структуры соответствует баланс потенциалов притяжения и отталкивания ионов:

$$U_{ij} = -\{\pm A Z_i Z_j e^2 / 4\pi\epsilon r_{ij}\} + b/r_{ij}^n, \quad (3)$$

где A – постоянная Маделунга, Z – заряды ионов, r_{ij} – межионные расстояния. Первое слагаемое

Таблица 3. Величины r_{cp} и объемов V для полиэдров в кристаллах LGN, LGT, CGG, LGS, SGG *

Кристалл	LGN	LGT	CGG	LGS	SGG
$r_{\text{cp}}(3e), \text{\AA}$	2.590	2.590	2.554	2.600	2.648
$r_{\text{cp}}(1a), \text{\AA}$	1.994	1.992	1.928	1.995	1.923
$r_{\text{cp}}(3f), \text{\AA}$	1.857	1.855	1.814	1.854	1.818
$r_{\text{cp}}(2d), \text{\AA}$	1.833	1.831	1.746	1.732	1.749
$V(3e), \text{\AA}^3$	28.827	28.827	27.260	28.727	30.343
$V(1a), \text{\AA}^3$	10.246	10.248	9.338	10.266	9.329
$V(3f), \text{\AA}^3$	3.111	3.114	2.909	3.076	2.944
$V(2d), \text{\AA}^3$	3.072	3.070	2.676	2.624	2.710

* Последовательность кристаллов в табл. 3–6 соответствует уменьшению угла φ .

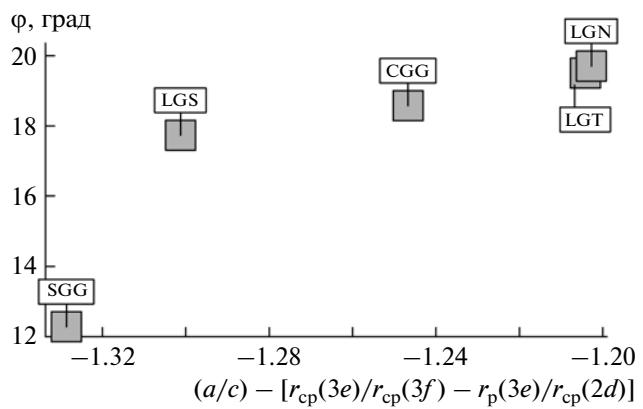


Рис. 3. Зависимость величины угла φ от разности $(a/c) - [r_{\text{cp}}(3e)/r_{\text{cp}}(3f) + r_{\text{cp}}(3e)/r_{\text{cp}}(2d)]$; a, c – параметры элементарной ячейки для кристаллов LGN, LGT, LGS, SGG, CGG.

соответствует потенциальну притяжения, второе – отталкивания. Потенциал отталкивания, в том числе ионов O^{2-} , возрастает в степенной зависимости по мере сближения ионов и перекрывания их электронных оболочек. При этом наличие составляющей поляризации α_{\perp} (1) электронной оболочки катионов, перпендикулярной химической связи, увеличивает зависимость потенциала отталкивания ионов O^{2-} от расстояния между ними (2).

Структура кристалла формируется по линиям взаимодействия катионов в полиэдрах, имеющих общие ребра $K(3e)$ и $K(1a)$, $K(3e)$ и $K(2d)$. Катионы $K(3e)$ и $K(3f)$ смещаются по оси C_2 , $K(2d)$ – оси C_3 .

Данные табл. 1–6 позволяют проследить динамику изменений угла φ в зависимости от структурных параметров и химических характеристик катионов. Отметим, что в дальнейшем тексте кристаллохимические характеристики второго и последующих кристаллов обсуждены в сравнении с предыдущим кристаллом.

Кристалл LGN с наибольшим значением угла φ возьмем за репер. Ионный радиус иона $Nb^{5+}(6)$ равен 0.68 Å, иона La^{3+} – 1.16 Å, ионов $Ga^{3+}(6)$, $Ga^{3+}(4)$ – 0.62, 0.47 Å соответственно. Угол φ равен разности угла разворота граней правильного октаэдра (60°) и удвоенного угла между ребром O_3-O_3 и высотой h октаэдра.

Отталкивание (через ребро O_3-O_3) высокозарядных катионов $La^{3+}(3e)$ и Nb^{5+} , $Ga^{3+}(1a)$ (табл. 1) для кристалла LGN максимально в рассматриваемом ряду. Компенсация отталкивания ионов O_3 , сближенных притяжением высокозарядными катионами, происходит путем увеличения h и соответствует минимальной величине отношения $\gamma = (O_3-O_3)/h$, равной 1.090 (табл. 6). Для кристалла LGN O_3-O_3 и h наиболее близки. Таким образом, для кристалла-репера LGN угол поворота

противоположных граней минимален, а угол ϕ – угол отклонения от 60° максимален (табл. 2).

Кристалл LGT отличается от *LGN* тем, что в нем в октаэдре $1a$ расположен более мелкий катион Ta^{5+} . Ион Ta^{5+} химически идентичен иону Nb^{5+} , но имеет меньший радиус 0.64 \AA и меньше сближает ионы O_3 .

Сравним параметры октаэдров для кристаллов *LGT* и *LGN*. Большему октаэдру в *LNG* соответствуют меньшие расстояния K – O_3 – O_3 (L в табл. 6) и длина связи K – O_3 . Октаэдр *LNG* вытянут по высоте – величина h равна 2.447 и 2.439 \AA для *LNG* и *LTG* соответственно. При этом уменьшение величины h для кристалла *LTG* больше уменьшения длины ребра O_3 – O_3 и наклон ребра O_3 – O_3 относительно высоты h октаэдра увеличивается. Это приводит к уменьшению угла ϕ (табл. 2).

Кристалл CGG отличается более мелкими катионами, но изменение заряда по позициям – разное: ионы $K(3e)$, $K(1a)$ имеют меньший заряд, а $K(3f)$, $K(2d)$ – больший (табл. 1). Ионные радиусы равны: $Ca^{2+} = 1.12$, $Ge^{4+}(6) = Ge^{4+}(4) = 0.53$, 0.39 \AA соответственно.

В структуре происходит уменьшение величин $r_{cp}(3e)$ ($2.59 \rightarrow 2.55 \text{ \AA}$) из-за меньших размеров катиона $K(3e)$ ($1.16 \rightarrow 1.12$) и высоты h октаэдра. По данным табл. 3, 4 относительные изменения радиальных и объемных параметров произошли в первом приближении только в тетраэдре $2d$. Притяжение ионов O^{2-} ионом с большим зарядом $Ge^{4+}(2d)$ уменьшает длину связи O_2 – O_2 ($3.765 \rightarrow 3.738 \text{ \AA}$) меньше, чем более удаленной от тетраэдра $2d$ связи O_3 – O_3 ($2.664 \rightarrow 2.590 \text{ \AA}$), так, что величина $(O_2$ – $O_2)/(O_3$ – $O_3)$ возрастает (табл. 6). В результате наклон ребра O_3 – O_3 относительно высоты h октаэдра увеличивается, а угол ϕ уменьшается (табл. 2).

Кристалл LGS аналог кристалла *CGG*, по относительным величинам r_{cp} полиэдров (табл. 3). Значительно увеличиваются длины связей O_2 – O_2 , O_3 – O_3 , $K(3e)$ – $(O_3$ – $O_3)$ из-за увеличения заряда и размера катиона $K(3e)$ (O_2 – $O_2)/(O_3$ – O_3). Увеличение h не так велико, так как разница в размерах катионов $K(1a)$ не так существенна, как для катионов $K(3e)$. В результате происходит увеличение наклона ребра O_3 – O_3 относительно h и уменьшение угла ϕ (табл. 2).

Кристалл SGG отличается максимальным ионным радиусом $K(3e)$, 1.26 \AA и меньшим ионным радиусом $K(1a)$ (ионов Ge^{4+} в октаэдре $1a$ – более 85%). В результате значительно возрастают величины β_1 , β_2 , β_3 , а также $(O_2$ – $O_2)/(O_3$ – $O_3)$. Величина h имеет минимальное значение в соответствии с минимальной величиной $r_{cp}(1a)$ (табл. 6). В результате в кристалле *SGG* величина угла ϕ достигает минимума в ряду кристаллов *LGN*, *LGT*, *CGG*, *LGS*, *SGG*.

Таблица 4. Величины $\beta_1 = r_{cp}(3e)/r_{cp}(1a)$, $\beta_2 = r_{cp}(3e)/r_{cp}(3f)$, $\beta_3 = r_{cp}(3e)/r_{cp}(2d)$ и аналогичные отношения объемов v_1 , v_3 , v_3 для кристаллов *LGN*, *LGT*, *CGG*, *LGS*, *SGG*

Кристалл	β_1	β_2	β_3	v_1	v_2	v_3
<i>LGN</i>	1.3	1.4	1.4	2.8	9.4	9.4
<i>LGT</i>	1.3	1.4	1.4	2.8	9.4	9.4
<i>CGG</i>	1.3	1.4	1.5	2.9	9.4	10.2
<i>LGS</i>	1.3	1.4	1.5	2.8	9.3	11.0
<i>SGG</i>	1.4	1.5	1.5	3.3	10.3	11.2

Таблица 5. Параметры ячейки и разность $\Delta = (a/c) - [r_{cp}(3e)/r_{cp}(3f) + r_{cp}(3e)/r_{cp}(2d)]$ для кристаллов *LGT*, *LGN*, *LGS*, *SGG*, *CGG*

Параметры ячейки, разность	Кристалл				
	<i>LGN</i>	<i>LGT</i>	<i>CGG</i>	<i>LGS</i>	<i>SGG</i>
$a, \text{ \AA}$	8.232	8.234	8.069	8.162	8.278
$c, \text{ \AA}$	5.129	5.124	4.974	5.095	5.040
Δ	0.195	0.185	0.156	0.105	0.100

Таблица 6. Длины связей K – O , O^{2-} – O^{2-} , расстояния L –катион–ребро K – $(O_3$ – $O_3)$, высота h октаэдра, отношение $\gamma = (O_3$ – $O_3)/h$ для кристаллов *LGN*, *LGT*, *CGG*, *LGS*, *SGG*

Кристалл	<i>LGN</i>	<i>LGT</i>	<i>CGG</i>	<i>LGS</i>	<i>SGG</i>
K – $O1(3e)$, \AA	2.620	2.619	2.591	2.643	2.637
K – $O2'(3e)$, \AA	2.879	2.876	2.849	2.886	2.887
K – $O2(3e)$, \AA	2.462	2.460	2.428	2.501	2.598
K – $O3(3e)$, \AA	2.413	2.417	2.348	2.355	2.482
O_2 – O_2 , \AA	3.766	3.765	3.738	3.903	4.047
O_3 – O_3 , \AA	2.667	2.664	2.590	2.673	2.635
$(O_2$ – $O_2)/(O_3$ – $O_3)$	1.41	1.41	1.44	1.46	1.54
$L(3e)$, \AA	2.015	2.019	1.957	1.941	2.103
$L(1a)$, \AA	1.482	1.483	1.430	1.480	1.400
$h, \text{ \AA}$	2.447	2.439	2.354	2.414	2.325
γ	1.090	1.092	1.100	1.107	1.133

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главные факторы, влияющие на величину рефракции кристаллов *LGN*, *LGT*, *LGS*, *SGG*, *CGG* – размеры полиэдров структуры, в первую очередь додекаэдра $3e$ и октаэдра $1a$. Это обусловлено зависимостью поляризуемости α от ионных радиусов, а также большими величинами α для

крупных высокозарядных ионов в додекаэдре $3e$ и высоким числом, связываемых с ними ионов O^{2-} . При этом ионы O^{2-} , как показано, дают основной вклад в величину рефракции.

Величины $R_{\text{эксп}}$, R_i пропорциональны параметру элементарной ячейки c . Этот факт, скорее всего, объясняется тем, что размер ячейки по оси c в большой степени определяется наиболее длинными химическими связями катиона додекаэдра и ионов O^{2-} . К этим связям относятся $K-O1$, $K-O2$, $K-O2'$. Поэтому основной вклад в средние размеры полизиков, которые влияют на величину поляризуемости, поступает от этих связей. Пропорциональность величин углов ϕ и $R_{\text{эксп}}$, R_i обусловлена тем, что эти величины пропорциональны поляризуемостям α катионов и ионов O^{2-} структуры. Отличие зависимости R и ϕ от структурных параметров связано с тем, что для угла ϕ главную роль играют относительные размеры полизиков.

Величина угла ϕ в ряду кристаллов LGN, LGT, CGG, LGS, SGG уменьшается. Это уменьшение является результатом уравновешивания потенциалов притяжения катионов в додекаэдре $3e$ и октаэдре $1a$ и отталкивания ионов O^{2-} в вершинах ребра $O3-O3$, что сохраняет устойчивость структуры.

Угол ϕ как структурная характеристика имеет множество “корреляций” с другими структурными характеристиками. Отмечены корреляции величины угла с рядом структурных параметров, в том числе с отношением длин связей $O2-O2(3e)/O3-O3(3e)$, применяемом при изучении пьезоэлектрических свойств кристаллов исследованного структурного типа. Величины угла также коррелируют с величинами отношения $V(3e)/V(2d)$ объемов додекаэдра $3e$ и тетраэдра $2d$. Показана корреляция зависимости величины угла от разности $(a/c) - [r_{\text{cp}}(3e)/r_{\text{cp}}(3f) - r_{\text{cp}}(3e)/r_{\text{cp}}(2d)]$, которая, по-видимому, соответствует отношению размеров октаэдра по осям a и c .

Из относительных величин средних радиусов, а также объемов полизиков, следует стабильность размеров октаэдра $1a$ и тетраэдра $3f$. Это означает, что изменения химического состава кристалла приводят к повороту этих полизиков относительно их общего иона $O3$ и к изменению угла ϕ . Нестабильный тетраэдр $2d$ в большей степени влия-

ет на длины связей. Так, по-видимому, происходят изменения в структуре, уравновешивающие потенциалы притяжения и отталкивания ионов при изменении химического состава.

Знак вращения плоскости поляризации особенно чувствителен к разности $\alpha_{||} - \alpha_{\perp}$. Отметим, что именно эта разность очень чувствительна к изменениям углов между химическими связями при вращении октаэдра $1a$ и тетраэдра $3f$.

Автор выражает благодарность А.П. Дудке за полезные замечания и помочь в работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Калдыбаев К.А., Константинова А.Ф., Перекалина З.Б. Гиротропия одноосных поглощающих кристаллов. М.: ИСПИН, 2000. 294 с.
2. Бацанов С.С. Структурная химия. Факты и зависимости. М.: Диалог-МГУ, 2000. 292 с.
3. Бацанов С.С. Экспериментальные основы структурной химии. М.: Изд-во стандартов, 1986. 239 с.
4. Молчанов В.Н., Максимов Б.А., Кондаков А.Ф. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2001. № 74. С. 244.
5. Миль Б.В., Клименкова А.А., Максимов Б.А. и др. // Кристаллография. 2007. Т. 52. № 5. С. 816.
6. Максимов Б.А., Молчанов В.Н., Миль Б.В. и др. // Кристаллография. 2005. Т. 50. № 5. С. 813.
7. Тюнина Е.А., Каурова И.А., Кузьмичева Г.М. и др. // Химия и технология неорганических материалов. 2010. Т. 5. № 1. С. 57.
8. Веремейчик Т.Ф., Симонов В.И. // Кристаллография. 2010. Т. 55. № 6. С. 1189.
9. Кизель В.А., Бурков В.И. Гиротропия кристаллов. М.: Наука, 1980. 304 с.
10. Glazer A.M., Stadnicka K. // J. Appl. Cryst. 1986. V. 19. № 1. P. 108.
11. Macfarlane P.I., Han T.P.J., Henderson B., Kaminskii A.A. // Opt. Mater. 1994. V. 3. P. 15.
12. Дудка А.П., Миль Б.В., Писаревский Ю.В. // Кристаллография. 2009. Т. 54. № 4. С. 599.
13. Dudka A.P. // J. Appl. Cryst. 2010. V. 43. P. 1440.
14. Дудка А.П., Симонов В.И. // Кристаллография. 2011. Т. 56. № 6. С.
15. Веремейчик Т.Ф., Галиуллин Р.В. // Неорган. материалы. 2002. Т.38. № 9. С. 1110.
16. Mill B.V., Pisarevsky Yu.V. // Proc. 2000 IEEE/EIA Intern. Frequency Control Symp., Kansas City, Missouri, USA, P. 133.